

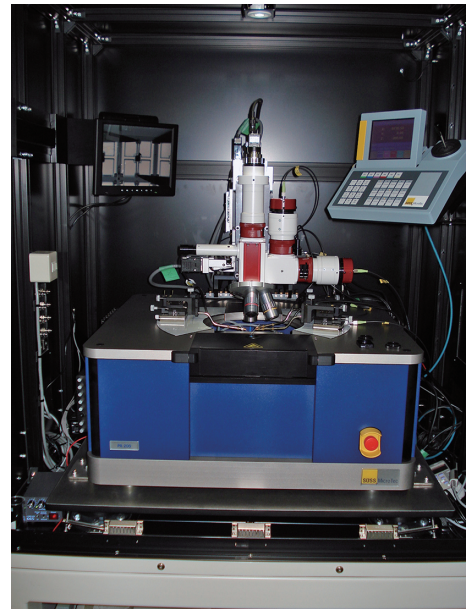
ウエハレベル受光素子光学特性測定装置

マニュアル・セミオートプローバシステムとの組み合わせにより、フォトダイオードや受光センサの各種光学特性をウエハレベルで測定・検査。

ウエハレベル受光素子特性測定装置は、フォトダイオードや受光センサ等各種受光素子の電気・光学特性測定をウエハレベルで解析するシステムです。受光用光半導体素子の特性計測に必要な電気的特性測定のほか、測定光導入による光学特性の測定をウエハレベルで行うことが可能です。セミオートプローバやマニュアルプローバ等の半導体故障解析用プローバシステムと、当社のプローバ用高機能光計測用光学系 M-Scope type I/PFW、測定用光源、測定器等を組合せて、光半導体素子の電気・光学諸特性をウエハレベルで解析・データ収集を行います。また、セミオートプローバとの組み合わせで、量産デバイスの自動測定にも対応可能です。

【特長】

- マニュアルプローバ・セミオートプローバとの組み合わせにより、フォトダイオードや受光センサ等受光素子のさまざまな電気・光学特性測定をウエハレベルで測定可能
- セミオートプローバシステムとの連動機能により、各種測定の自動化・高速化・省力化を実現。個別素子のオフライン測定からインライン測定まで幅広く対応。
- 当社製プローバ用光計測用光学系 M-Scope type I/PFW を搭載。受光素子の測定項目にあわせたシステムアップに対応。
- 当社製プローバ連動光計測・解析ソフトウェア Optometrics Customized Version for PD によるセミオートプローバの制御・連動による解析の自動化、電気・光学特性データの統合収集、測定品種や測定レシピの管理の一元化。



【プローバ連動光素子測定ソフトウェア Optometrics Customized Version for PD】

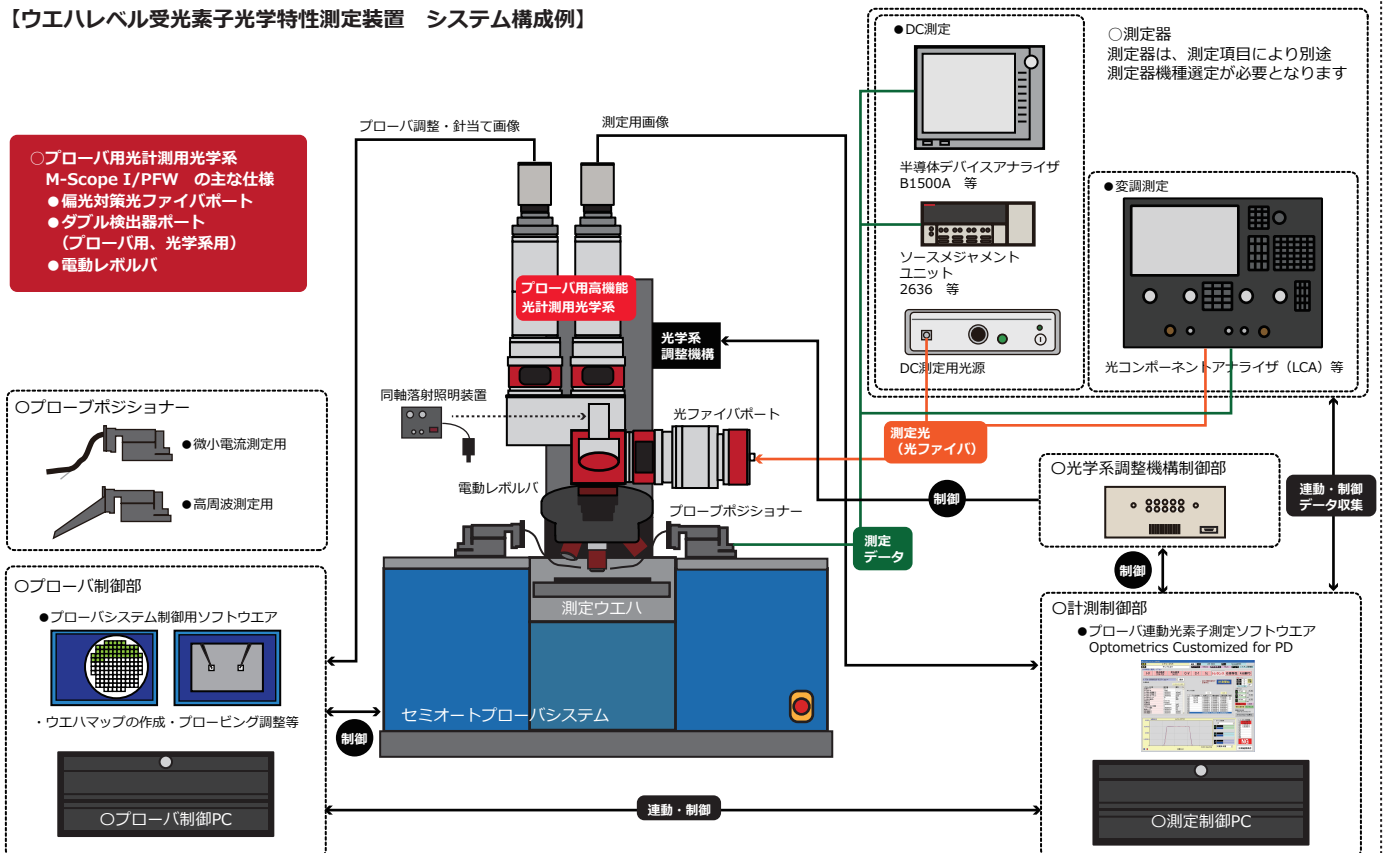


ウエハレベル光素子測定装置用に開発、セミオートプローバの制御・連動による解析の自動化、電気・光学特性データの統合収集、測定品種や測定レシピの管理を行うソフトウェアです。オフライン測定からインライン自動測定まで幅広い対応が可能です。計測項目は、測定対象・測定内容・使用する測定器・測定手順や運用によりソフトウェアのカスタマイズを行います。

(主な測定対応項目)

- フォトダイオード、受光センサ等受光素子の電気・光学特性
 - I-V 特性、光感度、容量、変調周波数特性、立上り・立下り、トランス、クロストーク等

【ウエハレベル受光素子光学特性測定装置 システム構成例】



*本システムは、測定対象サンプル・測定仕様・運用方法等より、さまざまな構成・仕様のご提案が可能です。